

сообщения
объединенного
института
ядерных
исследований
дубна

3649 / 2-80

18-80-337

18-80

А.Эрнандес, Д.Рубио

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОНЕЙТРОНОВ
И ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МИКРОТРОНА
ДЛЯ МНОГОЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА
ЖЕЛЕЗИСТЫХ ЛАТЕРИТОВЫХ РУД

1980

Многоэлементный анализ проб пород и руд с помощью радиоактивационных методов представляет определенные трудности, связанные с тем, что не все элементы достаточно хорошо активируются нейтронами или γ -квантами /1-3/. Для преодоления этих трудностей целесообразно комплексное применение гамма- и нейтронно-активационных методов анализа /ГАА/ и /НАА/ с помощью электронных ускорителей /4/. Одним из наиболее подходящих для этого ускорителей является микротрон /5-7/.

В настоящей работе предлагается методика для анализа Ni , Fe , Co , Cr , Al , Mg , Si и Mn в железистых латеритах, при комплексном применении гамма- и нейтронного пучков микротрона с энергией электронов 16 МэВ и средним током 25 мкА.

ГАММА- И НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ЖЕЛЕЗИСТЫХ ЛАТЕРИТОВЫХ РУД

В состав железистых латеритовых руд входит ряд элементов, которые сравнительно хорошо активируются тепловыми нейтронами / Co , Al , Mn / или быстрыми нейтронами / Mg , Si /. Другие, как, например, Ni , Fe , Cr , эффективнее активировать гамма-квантами. Исходя из критерия достижения наибольшей экспрессности при обеспечении удовлетворительной чувствительности и точности анализов, в работе был экспериментально установлен оптимальный вариант определения содержания данных элементов в железистых латеритах. При этом учитывался и тот факт, что при облучении тормозным излучением микротрона можно использовать для аналитических целей как γ -кванты, так и быстрые нейтроны, образованные в мишени.

Определение содержания Fe , Ni , Cr , Mg осуществляется при одновременном одновременном облучении 10 проб тормозным излучением микротрона по реакциям, приводимым в табл.1. После облучения проводятся:

- 1/ измерения активности $^{58}\text{Fe} / t_{\text{изм}} = 80 \text{ с}/;$
- 2/ одновременное измерение ^{57}Ni , ^{48}Cr , $^{24}\text{Na} / t_{\text{изм}} = 3 \text{ мин}/.$

Анализ Si /см. табл.1/ осуществляется при 5-минутном облучении и 3-минутном измерении активности ^{28}Al . При наличии пневмопочты возможно определение Si в ~12 пробах за час одновременно с проведением анализа Fe , Ni , Cr и Mg .

Таблица 1

Элементы, активируемые γ -квантами и быстрыми нейтронами в железистых латеритах при их облучении тормозным излучением микротрона

Элемент	Образующийся изотоп	Реакция	$E^{(2)}$, кэВ (выход, %)	$T_{1/2}$ (I)
Никель	^{57}Ni	$^{58}\text{Ni}(\gamma, n)^{57}\text{Ni}$	$^{127}(14), ^{1378}(86)$ $^{1890}(14)$	36 д.
Железо	^{53}Fe	$^{54}\text{Fe}(\gamma, n)^{53}\text{Fe}$	$^{378}(32)$	8,5 мин
Кобальт	^{58}Co	$^{59}\text{Co}(\gamma, n)^{58}\text{Co}$	$^{810}(99), ^{865}(1,4)$	71,3 д
Хром	^{49}Cr	$^{50}\text{Cr}(\gamma, n)^{49}\text{Cr}$	$^{90}(28), ^{153}(13)$	41,9 мин.
	^{51}Cr	$^{52}\text{Cr}(\gamma, n)^{51}\text{Cr}$	$^{320}(9)$	27,8 д.
Магний	^{24}Na (3)	$^{24}\text{Mg}(\text{n}, \text{p})^{24}\text{Na}$	$^{1365}(100), ^{2754}(100)$	154.
Кремний	^{28}Al (3)	$^{28}\text{Si}(\text{n}, \text{p})^{28}\text{Al}$	$^{1778}(100)$	2,3 мин.
Марганец	^{54}Mn	$^{55}\text{Mn}(\gamma, n)^{54}\text{Mn}$	$^{834}(100)$	303 дн.
Хлор	^{34}Cl	$^{35}\text{Cl}(\gamma, n)^{34}\text{Cl}$	$^{145}(45), ^{1170}(12),$ $^{2120}(36)$	32,4 мин.
Мышьяк	^{74}As	$^{75}\text{As}(\gamma, n)^{74}\text{As}$	$^{596}(61), ^{635}(14)$	17,5 дн.
Титан	^{47}Sc	$^{47}\text{Ti}(\text{n}, \text{p})^{47}\text{Sc}$	$^{160}(73)$	3,4 дн.
Цирконий	^{89}Zr	$^{90}\text{Zr}(\gamma, n)^{89}\text{Zr}$	$^{910}(99), ^{1710}(1)$	794.
Сурьма	^{122}Sb	$^{123}\text{Sb}(\gamma, n)^{122}\text{Sb}$	$^{564}(66), ^{686}(3,4)$	2,8 дн.
Иод	^{126}I	$^{127}\text{I}(\gamma, n)^{126}\text{I}$	$^{386}(34), ^{667}(33)$	13,3 дн.

/1/ Литературные данные /12/.

/2/ Подчеркнуты энергии γ -линий, использованные для аналитических целей.

/3/ Проверено экспериментально, что в рассматриваемом диапазоне концентраций Na, Al эти элементы не дают мешающего вклада по реакциям $^{28}\text{Na}(\text{n}, \gamma)^{24}\text{Na}$, $^{27}\text{Al}(\text{n}, \gamma)^{28}\text{Al}$.

Анализ Co, Al, Mn производится нейтронно-активационным методом при 10-минутном облучении образцов, расположенных в графитовой призме микротрона /7/, тепловыми нейтронами, по реакциям, показанным в табл. 2. Определение Co осуществляется при измерении $t_{\text{изм}} / t_{\text{изм}} \leq 8$ мин/наведенной активности X-лучей внутренней конверсии ^{80}Mn $\text{Co}/E_{K\alpha} = 6,9$ кэВ/. Определение Al и Mn производится $t_{\text{изм}} = 1$ мин/ по изотопам ^{28}Al и ^{58}Mn .

Таблица 2

Элементы, активируемые в пробах железистых латеритовых руд при их облучении тепловыми нейтронами

Элемент	Образующийся изотоп	Реакция	G , мбарн	$E^{(1)}$, кэВ (выход, %)	$T_{1/2}^{(1)}$
Кобальт	^{60}Co	$^{59}\text{Co}(\text{n}, \gamma)^{60}\text{Co}$	1800	$^{59}(2,1), ^{1330}(0,25)$	10,5 мин.
Алюминий	^{27}Al	$^{27}\text{Al}(\text{n}, \gamma)^{28}\text{Al}$	235	$^{1778}(100)$	2,3 мин.
Марганец	^{55}Mn	$^{55}\text{Mn}(\text{n}, \gamma)^{56}\text{Mn}$	15300	$^{846}(99), ^{1811}(29)$ $^{2110}(15)$	2,64.
Ванадий	^{51}V	$^{51}\text{V}(\text{n}, \gamma)^{52}\text{V}$	4900	$^{1434}(100)$	3,75 мин.
Титан	^{51}Ti	$^{50}\text{Ti}(\text{n}, \gamma)^{51}\text{Ti}$	140	$^{320}(95), ^{605}(15)$ 928(5)	5,6 мин.

/1/ Данные взяты из /12/.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. ОБРАЗЦЫ И МОНИТОРЫ

В качестве источника нейтронов и γ -излучения использовался микротрон Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ с энергией электронов примерно 16 МэВ и средним током 25 мкА /8/.

Для измерения γ - и X-излучений активированных образцов были использованы Ge(Li)-ППД с чувствительным объемом 23 см³, разрешением 3,5 кэВ по линии 662 кэВ и Si(Li) - ППД, у которого диаметр чувствительной поверхности - 5,12 мм и разрешение для K_{α} линии железа - 190 эВ. Для регистрации и обработки информации использовался 4096-канальный анализатор, разработанный и собранный в ОИЯИ /9/ на основе микропроцессора "INTEL-8080" и 800-канальный анализатор фирмы "Nokia" типа LP-4840.

Образцы в виде порошков весом около 1,5 г были упакованы в плексигласовые бюксы внутренним диаметром 20 мм и высотой 4 мм. Один из торцов бюксов закрыт лавсановой пленкой толщиной 10 мк для обеспечения минимального поглощения X-лучей кобальта.

Для облучения образцов тормозным излучением микротрона была использована подставка, показанная на рис. 1. Учет спада интенсивности γ -квантов с увеличением расстояния между про-

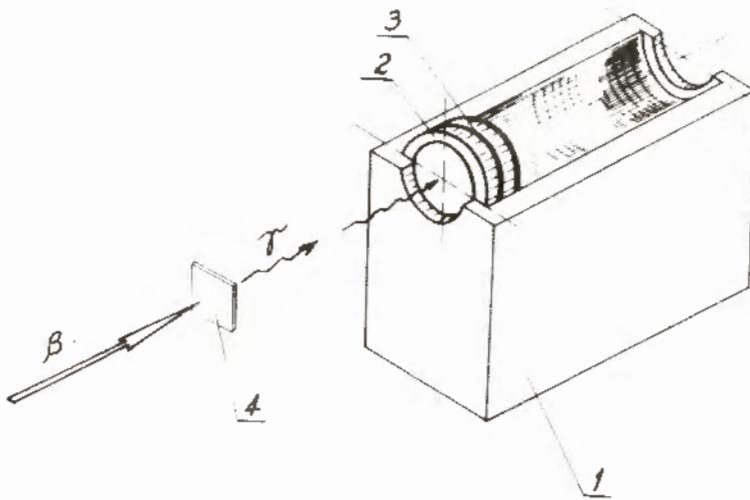


Рис.1. Подставка для облучения образцов тормозным излучением микротрона. 1 - плексигласовая подставка, 2 - образец, 3 - медный монитор, 4 - тормозная мишень.

бами и тормозной мишенью осуществлялся с помощью медных фольг диаметром 25 мм и весом 400 мг. Для мониторирования потока тепловых нейтронов использовались алюминиевые фольги диаметром 25 мм и весом 90 мг.

В работе использовались геологические пробы железистых латеритовых руд с известным содержанием Fe, Ni, Co /данные химического анализа/. Для количественных определений использовались четыре стандарта, изготовленных в нашей лаборатории.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА

Время измерения активности короткоживущих изотопов надо выбирать таким образом, чтобы площадь фотопика данного изотопа в последнем из измеряемых образцов была максимально возможной. С этой целью на основе уравнения активации и условия максимума измеряемой площади фотопика выведена следующая формула для оптимального времени измерения

$$t_{\text{изм}}^{\max} = \frac{\ln N/N-1}{\lambda},$$

/1/

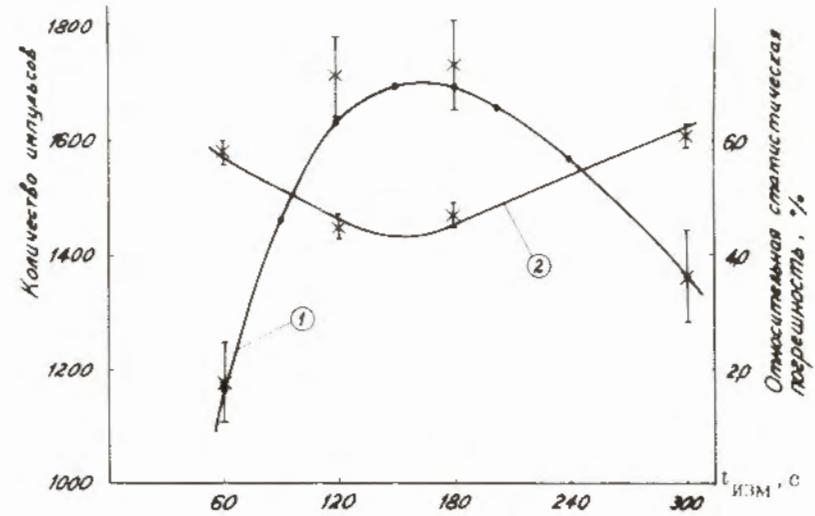


Рис.2. К выбору оптимального времени измерения активности изотопа ^{58}Fe /1/. Зависимость площади фотопика $E_\gamma = 378$ кэВ N-ого образца от $t_{\text{изм}}$.
 -●-● - расчетные данные; *-* - экспериментальные данные. /2/ Экспериментальные значения относительной статистической погрешности измерения площади фотопика N-ого образца при режимах с различными $t_{\text{изм}}$.

где $t_{\text{изм}}^{\max}$ - время измерения, соответствующее максимальной площади фотопика N-го образца, N - число измеряемых образцов, λ - постоянная распада измеряемого изотопа.

В качестве примера на рис.2/1/ показана зависимость измеряемой площади фотопика ^{58}Fe N-го образца ($N=5$) от времени измерения. Как следует из рисунка, существует удовлетворительное, в пределах погрешности измерения, совпадение расчетных и экспериментальных данных. На рис.2/2/ показан экспериментальный ход относительной статистической погрешности с ростом $t_{\text{изм}}$. Как видно, $t_{\text{изм}}$, соответствующее минимальной ошибке, также совпадает в пределах ошибок с $t_{\text{изм}}^{\max}$, вычисленным по формуле /1/.

При $N=10$ из /1/ имеем $t_{\text{изм}}^{\max}=77,5$ с для ^{58}Fe . На практике для определения железа при $N=10$ и выборе $t_{\text{изм}}=60,80, 100, 110, 180$ с наилучшие результаты были получены в режиме с $t_{\text{изм}}=80$ с.

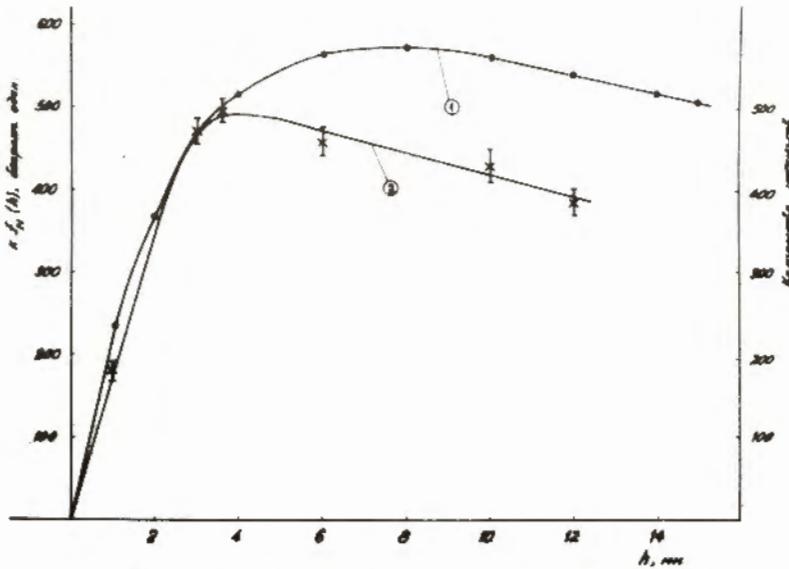


Рис.3. К определению оптимальной толщины проб при облучении N образцов γ -квантами. —●— — теоретическая кривая $f_N(h)$, где $k=7,6 \cdot 10^7$; —+— экспериментальные значения площади фотопика $^{57}\text{Ni} / E_y = 1378 \text{ кэВ}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ПРОБ ПРИ МАССОВОМ ОБЛУЧЕНИИ γ -ПУЧКОМ

Выбор размеров проб, при массовом облучении тормозным излучением микротрона, должен учитывать особенности углового и пространственного распределений γ -квантов^[11]. Определенная роль принадлежит также и геометрии измерения.

В настоящей работе мы взяли диаметр проб равным диаметру круглого сечения пучка γ -квантов в плоскости первого образца, а для определения толщины пробы h исходили из требования, что активность, наведенная в наиболее отдаленном от мишени образце, должна быть максимально возможной. Увеличение h пробы приведет с одной стороны к нарастанию навески и соответственно активности, с другой — к уменьшению активности N-ого образца вследствие убывания интенсивности γ -квантов с расстоянием. Нами проверено, что спад интенсивности γ -квантов в отсутствие подставки с образцами можно описать зависимостью $\sim \frac{1}{R^{1.8}}$ — R — расстояние от тормозной мишени/. Убывание интенсивности γ -квантов вдоль подставки, загруженной образ-

цами латеритовых руд, описывается зависимостью $\sim \frac{1}{R^{1.9}}$, что указывает на дополнительное ослабление потока, вызываемое поглощением и рассеянием γ -квантов образцами. Итак, зависимость активности N-ого образца от толщины проб можно представить в виде функции

$$f_N(h) = \frac{h}{(R_0 + (N-1)h)^{1.9}},$$

/2/

где R_0 — расстояние от тормозной мишени до центра первой пробы. На рис.3 /1/ представлен график $f_N(h)$ при $R_0 = 60 \text{ мм}$, $N = 10$, что соответствует нашим экспериментальным условиям. Из рисунка видно, что $h_{\text{opt}} = 7,5 \text{ мм}$. На рис.3 /2/ показаны экспериментальные данные зависимости площади фотопика $^{57}\text{Ni} / E_y = 1378 \text{ кэВ} / N$ -ого образца от толщины проб. Расхождение экспериментальных данных с теоретической кривой для $h > 3,5 \text{ мм}$ объясняется влиянием геометрии измерения. При этом значение h_{opt} оказывается, как и следовало ожидать, несколько меньшим, чем рассчитанное по формуле /2/.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В табл.3 приведены результаты ГАА и НАА Ni, Fe, Co в железистых латеритах. Из таблицы следует, что полученные с помощью этих анализов данные хорошо совпадают с результатами химического анализа /ХА/. Расхождения с данными ХА не превышают 15–18%. Как следует из табл.3 и рис.4, существует хорошая корреляция между результатами ГАА и ХА при определении Ni /r = 0,995, b = -0,980, a = 0,0013/ и Fe /r = 0,999, b = 1,025, a = -0,265/, а также /рис.5/ между НАА и ХА при определении содержания Co /r = 0,997, b = 0,977, a = 0,0012/. Из-за отсутствия достаточного количества образцов с известным содержанием остальных элементов, корреляционный анализ результатов ГАА, НАА и ХА этих элементов сделан не был.

Минимальная концентрация C^{min} , которую можно обнаружить с надежностью анализа 99%^[10], достигает 0,8% Fe, $5 \cdot 10^{-2}$ % Ni; $4 \cdot 10^{-3}$ % Co, $8 \cdot 10^{-2}$ % Cr, $6 \cdot 10^{-2}$ % Al, $7 \cdot 10^{-1}$ % Mg, 1% Si и 10^{-2} % Mn.

Точность анализов не хуже 3% /C ≥ 10% Fe, tизм = 80 с/, 15% /C ≥ 10% Ni/, 10% /C ≥ 10% Co/, 3% /C ≥ 1% Cr/, 2% /C ≥ 1% Al/, 15% /C ≥ 1% Mg/, 8% /C ≥ 2% Si/ и 1% /C ≥ 2 · 10⁻¹% Mn/.

На рис.6 показаны участки спектра образца железистых латеритовых руд, облученного на γ -пучке /а/ и на тепловых нейтронах /б, в/ микротрона. Присутствие K_α -линии Fe /рис.6/

Таблица 3

Результаты ГАА определения Fe, Ni и НА определения Co
в железистых латеритах

№	Гамма-активационный анализ		Нейтронный активационный анализ		Химический анализ		
	Содержание, %		Содержание, %		содержание, %		
	железо	никель	железо	никель	железо	никель	кобальт
I	2	3	4	5	6	7	
1.	9,7±0,3	0,10±0,01	0,004±0,001	9,98±0,43	0,10±0,01	0,004±0,001	
2.	9,0±0,4	0,11±0,01	0,004±0,001	10,18±0,21	0,10±0,01	0,005±0,002	
3.	9,0±0,2 ⁽¹⁾	0,11±0,01	0,004±0,001	10,48±0,22	0,10±0,01	0,004±0,001	
4.	8,6±0,4	0,08±0,01	0,003±0,001	9,17±0,40	0,09±0,01	0,004±0,001	
5.	49,0±0,7	1,03±0,02	0,009±0,001	52,0±0,42	1,06±0,05	0,010±0,002	
6.	7,2±0,4	0,70±0,02	0,012±0,001	6,14±0,26	0,66±0,05	0,010±0,002	
7.	6,8±0,5	0,68±0,03	0,013±0,001	6,34±0,28	0,64±0,05	0,012±0,002	
8.	6,0±0,2 ⁽¹⁾	0,21±0,01	0,014±0,001	6,76±0,30	0,23±0,03	0,013±0,003	
9.	9,4±0,2	0,63±0,01	0,021±0,002	9,92±0,40	0,62±0,05	0,019±0,002	
10.	43,8±0,9	0,41±0,02	0,024±0,002	43,77±0,39	0,38±0,04	0,023±0,004	
11.	44,4±1,1	0,70±0,02	0,028±0,002	43,99±0,40	0,69±0,05	0,028±0,004	
12.	44,8±0,8 ⁽¹⁾	0,64±0,03	0,031±0,002	43,94±0,40	0,63±0,04	0,030±0,005	
13.	49,6±1,0 ⁽¹⁾	0,92±0,04	0,034±0,002	46,79±0,42	0,82±0,06	0,031±0,005	
14.	15,9±0,6	1,41±0,03	0,034±0,002	14,07±0,21	1,36±0,07	0,032±0,005	
15.	50,7±1,1	0,74±0,03	0,040±0,004	49,27±0,44	0,77±0,05	0,038±0,006	
16.	17,0±0,5	1,70±0,02	0,039±0,002	18,35±0,39	1,80±0,09	0,038±0,006	
17.	16,8±0,6	1,32±0,03	0,040±0,002	14,85±0,31	1,43±0,07	0,040±0,006	
18.	44,6±0,9	0,65±0,02	0,046±0,002	44,17±0,40	0,68±0,05	0,041±0,006	
19.	17,0±2,2	1,74±0,03	0,048±0,002	15,11±0,32	1,81±0,09	0,042±0,006	
20.	50,1±1,3	0,92±0,03	0,046±0,002	51,67±0,41	1,02±0,05	0,043±0,007	
21.	58,7±4,1 ⁽¹⁾	0,66±0,03	0,043±0,002	49,78±0,44	0,65±0,04	0,046±0,007	
22.	50,2±1,1 ⁽¹⁾	0,52±0,03	0,046±0,005	48,78±0,45	0,55±0,04	0,048±0,007	
23.	18,7±0,3	1,07±0,04	0,059±0,003	19,25±0,40	0,93±0,07	0,061±0,005	
24.	49,8±0,5	1,32±0,03	0,094±0,006	49,47±0,45	1,35±0,07	0,094±0,008	
25.	52,6±1,8	0,85±0,02	0,109±0,004	50,12±0,40	0,87±0,06	0,114±0,006	
26.	45,3±1,3 ⁽¹⁾	1,80±0,03	0,105±0,006	39,36±0,43	1,64±0,08	0,123±0,006	
27.	49,8±1,3 ⁽¹⁾	1,00±0,03	0,156±0,006	49,80±0,45	1,04±0,05	0,161±0,006	
28.	45,6±1,2 ⁽¹⁾	1,13±0,04	0,162±0,007	45,61±0,41	1,17±0,06	0,169±0,008	
29.	51,9±1,5 ⁽¹⁾	0,94±0,04	0,197±0,006	51,4±0,41	0,95±0,07	0,182±0,008	
30.	55,7±1,6 ⁽¹⁾	0,97±0,04	0,184±0,005	52,07±0,42	1,06±0,05	0,190±0,008	
31.	50,1±1,5	1,22±0,02	0,192±0,006	48,61±0,44	1,30±0,06	0,196±0,010	
32.	48,5±3,4	1,11±0,03	0,218±0,004	52,18±0,42	1,20±0,06	0,220±0,009	
33.	45,6±1,4	0,55±0,02	0,021±0,002	41,81±0,38	0,51±0,04	0,019±0,004	

/1 t изм = 80 с.

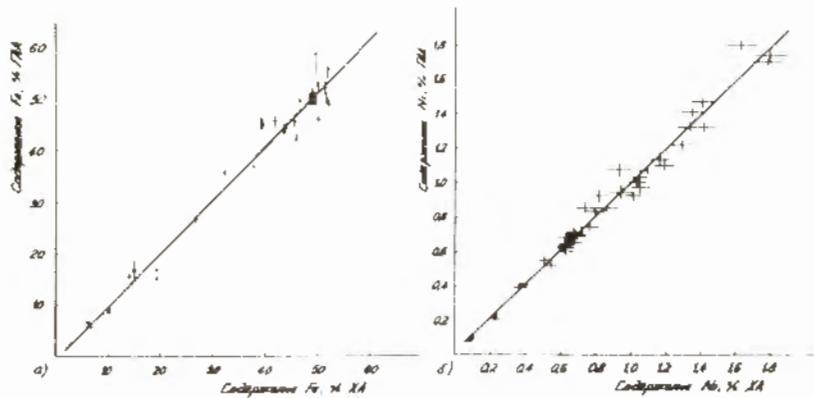


Рис. 4. Корреляционная зависимость результатов ГА и химического методов анализа железистых латеритовых руд; а/ при определении железа; б/ при определении никеля.

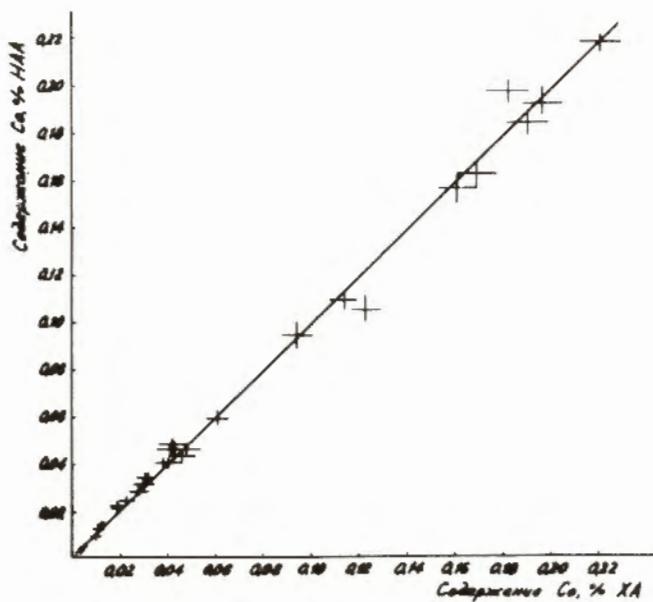


Рис. 5. Корреляционная зависимость результатов НА и химического методов анализа при определении кобальта.

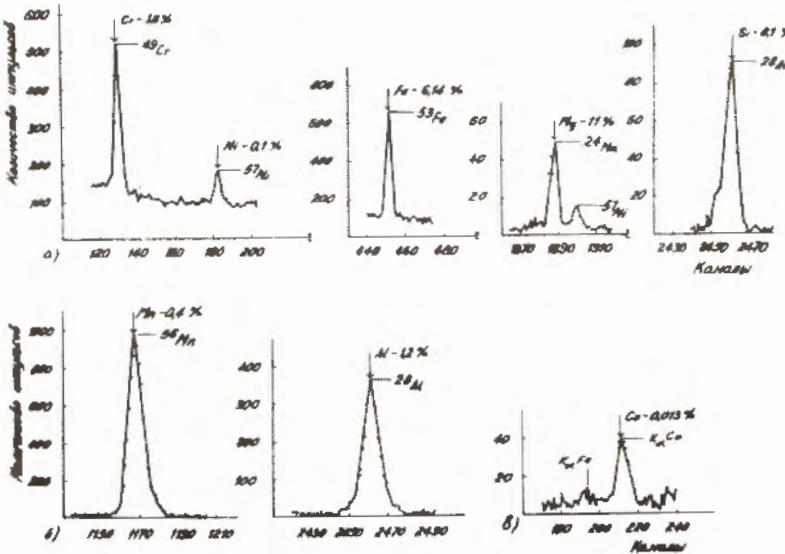


Рис.6. Спектры облученного образца железистых латеритовых руд; а/ участки γ -спектра после облучения тормозным излучением микротрона; б/ участки γ -спектра после облучения на тепловых нейтронах; в/ спектр X-лучей после облучения на тепловых нейтронах.

объясняется возбуждением характеристических лучей этого элемента посредством излучения изотопов матрицы.

Заметим, что: а/ чувствительность и точность анализов Si можно повысить соответствующим увеличением навески образцов; б/ при НАА Co, Al и Mn целесообразно использовать пневмопочту; в/ применение нескольких Si(Li) - ППД увеличивает во столько же раз производительность анализов при измерении X-лучей Co.

При наличии пневмопочты, двух Ge(Li) - ППД и двух Si(Li) - ППД производительность методики составляет за 8-часовую смену:

- 200 элементных определений % содержания / Fe, Ni, Cr, Mg, Si / в 40 пробах;
- 160 элементных определений % содержания Al, Mn в 80 пробах одновременно с 48 анализами Co.

Это означает, что производительность составляет 50 элементных определений в час. При настоящих экспериментальных условиях производительность составляет 30 элементных определений данных химических элементов в час.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предлагается методика многоэлементного анализа проб железистых латеритовых руд на основе комплексного использования фотонейtronов и тормозного излучения микротрона.

2. Достигнута чувствительность анализа для Fe- $8 \cdot 10^{-1}\%$, Ni- $5 \cdot 10^{-2}\%$, Co- $4 \cdot 10^{-3}\%$, Cr- $8 \cdot 10^{-2}\%$, Al- $6 \cdot 10^{-2}\%$; Mg- $7 \cdot 10^{-1}\%$, Si- 1% , Mn- $10^{-2}\%$.

3. Точность анализов во всех случаях не хуже: $3\% / C \geq 10\% Fe /$, $15\% / C \geq 10^{-1} \% Ni /$, $10\% / C \geq 10^{-2} \% Co /$, $3\% / C \geq 1\% Cr /$, $15\% / C \geq 1\% Mg /$, $8\% / C \geq 2\% Si /$, $2\% / C \geq 1\% Al /$ и $1\% / C \geq 4 \cdot 10^{-1} \% Mn /$.

4. Производительность методики составляет 30-50 элементных определений процентного содержания Fe, Ni, Co, Cr, Mg, Al, Si, Mn в час.

5. При корреляционном анализе результатов ГАА, НАА и ХА Fe, Ni, Co получены коэффициенты корреляции 0,999, 0,995, 0,997 соответственно.

6. Выведена формула для расчета оптимального времени последовательного измерения проб в зависимости от их числа и постоянной распада измеряемого изотопа.

7. Установлен критерий для выбора оптимальных толщин проб при одновременном облучении N-образцов тормозным излучением микротрона.

Авторы глубоко признательны Г.Н.Флерову за постановку проблемы и постоянный интерес к работе; Ю.С.Замятину и Л.П.Кулькиной за поддержку и ценные замечания, В.Я.Выропаеву за полезное обсуждение результатов, а также А.Г.Белову и В.Е.Жучко за помощь и техническое обеспечение экспериментов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зайцев Е.И., Сотсков Ю.П., Резников Р.С. Нейтронно-активационный анализ горных пород на редкие элементы. "Недра", М., 1978.
2. Lutz G. Analyt.Chem., 1971, 43, No.1, p.93.
3. Бровцын В.К. и др. Сб. статей "Активационный анализ", Изд-во ФАН, Ташкент, 1971, с.70.
4. Бровцын В.К. и др. Сб. статей "Ядерно-физические методы анализа вещества". Атомиздат, М., 1971, с.216.
5. Бровцын В.К., Самосюк В.Н., Ципенюк Ю.М. АЭ, 1972, 32, с.383.

6. Капица С.П. и др. АЭ, 1973, 34, с.199.
7. Базаркина Т.В. и др. ОИЯИ, 18-12699, Дубна, 1979.
8. Выропаев В.Я. ОИЯИ, 14-9446, Дубна, 1976.
9. Глейбман Э.М., Жучков В.Е. ОИЯИ, 10-8051, Дубна, 1980.
10. Хуснутдинов Р.И., Лобанов Е.М., Мингалиев Т.Г. Сб. статей "Активационный анализ", Изд-во ФАН, Ташкент, 1971, с.9.
11. Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов. Атомиздат, М., 1979.
12. Lederer M.C., Hollander J.M., Perlman I. Table of Isotopes. 6th Edition, John Wiley and Sons, 1967.

Рукопись поступила в издательский отдел
7 мая 1980 года.